

Метрологическое обеспечение измерений плотности материалов покрытий

четверг, 20 марта 2025 г. 13:22 (12 минут)

Рентгенофлуоресцентный метод измерений толщины металлических покрытий является одним из самых востребованных неразрушающих методов в связи с развитием высокотехнологичного сектора машиностроения, приборостроения и электроники. В виду ограничения данного метода в части использования справочного значения плотности материалов покрытий при определении толщины металлических покрытий остро стояла задача разработки методических подходов для определения плотности материалов нанесенных покрытий. Авторами предложена физико-математическая модель измерений плотности материалов покрытий, которая была подтверждена экспериментальными исследованиями моделей покрытий и легла в основу разработанной методики количественного определения плотности покрытий для измерений толщины покрытий рентгенофлуоресцентным методом.

Научный руководитель

к.ф.-м.н., Тюрнина Анастасия Евгеньевна, turninaae@uniim.ru, Уральский научно-исследовательский институт метрологии — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург

Секция

Молодежная секция

Основной автор: ШИПИЦЫНА, Мария Вячеславовна (Уральский научно-исследовательский институт метрологии — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Соавтор: ТЮРНИНА, Анастасия Евгеньевна (Уральский научно-исследовательский институт метрологии — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Докладчик: ШИПИЦЫНА, Мария Вячеславовна (Уральский научно-исследовательский институт метрологии — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Классификация сессии: Молодежная секция. Устные доклады.

Классификация трека: Стандартизация и метрологическое обеспечение средств НК.